#### 1. 安装样品架

将合适的样品架放置在 MFK1-FA 卡帕桥磁化率仪的检测单元 (Pick-up unit)的升降架上,并固定好。将样品架的数据传输线连接到检测单元上相应的端口上。——调取 file-l-1

### 3. 启动 MFK1-FA 卡帕桥磁化率仪

确认连接好电源后,打开 MFK1-FA 卡帕桥磁化率仪控制单元的电源键,开启仪器,按下背后的红色电源键按钮从 "o"至"-"。黄灯亮起,"滴"一声出现,确定仪器打开。——调取 file-I-2

## 5之后

——调取 synchroS-2

## 2. 启动计算机

确认连接好电源后, 开启与仪器相连的计算机。

## 4. 运行程序 SAFYR6.EXE

双击桌面上的程序 SAFYR6.EXE, 打开后, 开始测量步骤。——调取 file-S-1

## 5. 初始化程序

点击程序左下方的"ACTIVE",初始化程序。当程序运行条全部变绿后,初始化成功。——调取 file-S-2

## 6. 预热

待初始化程序后,点击"OK",开始 预热,10分钟。——调取 file-S-3

# 7. 设置参数,准备测量(软件端)

预热完成后,根据所需实际情况, 在下拉菜单"setting"中选择"Instrument setting 可以设置以下参数:

测量模式(Measurement mode) 测量场强度(Field intensity) 工作频率(Operating frequency) 体积/质量磁化率(Bulk/Mass susceptibility)

——开始选择测量参数

# ——调取 file-S-4

### A、磁化率各向异性测量

在 "Instrument setting"下的 "Measurement mode"选择 "Anisotropy",根据使用的样品架进行 选择"Automatic(spinning specimen)" 在"Bulk/Mass susceptibility"选择默认 "Bulk susceptibility","Volume"填写 样品体积;"Field intensity"默认"200"; "Operating frequency"默认F1.

### ——调取 file-S-5

## a、设置定向参数

在下拉菜单"setting"中选择 Orientation parameters"进行定向参数的 设置。

根据自身样品特征填写参数

P1:样品顶面上所画标志线的方向 (3:右手走向;6:倾向;9:左手走向;12:反 倾向)。

P2:为 0 或 90。0 表示测量的是样品 顶面的产状,90 表示测量的是圆柱轴向的产状。

P3:野外所测量标志线的方向(3:右手走向;6:倾向;9:左手走向;12:反倾向)。

P4:为 0 或 90。地层的产状, 0 表示测量的是地层的倾向和倾角, 90 表示测量的是地层的右手走向和倾角。

默认参数: P1=12; P2=0; P3=12; P4=0 ——调取 file-S-6

## b、标样校准

仪器的校准周期到后,利用厂家为 仪器配备的标样(MFK1FAS1)执行标样 校准。将标样放入样品架中,固定好。

——调取 file-I-3

然后在"Execute"下拉菜单中选择 "Calibration",窗口弹出,窗口记录有过去校准的数值和新测量的数值。点击"START"开始校准。——调取 file-S-7

架子下降至桶内,样品旋转开始测量。 ——调取 file-I-4

取出标样。

——调取 file-I-5

c、Holder 测量

校准完成后,点击"SAVE"保存新的校准数据。——调取 file-S-8

保持样品架干净,无误 ——调取 file-I-6 在 "Execute" 下 拉 菜 单 中 选 择 "Holder correction"",窗口弹出。——调取 file-S-9

点击"START"开始测量,测量完成后,窗口最下部显示"HOLDER CORRECTION ROUTINE WAS SUCCESSFUL"保持绿色即可。点击"SAVE"保存新的 Holder 数据。测量样品的磁化率及其各向异性时,仪器将自动扣除Holder 值。——调取 file-S-10

## d、样品测量

(a) 新建数据文件

建立一个新的文件夹。在"File"下拉菜单中选择"New file"。窗口弹出。设置好目录和名称之后,点击"OPEN GEOLOGICAL FILE",选择所需要的样品产状文件,程序将自动调用产状文件中的样品产状数据。点击"OK"确认。

打开已经存在的文件夹。在"File"下拉菜单中选择"Open New file"。新的测量数据将被添加到该文件夹中。——调取 file-S-11

(b) 输入样品信息

点击"NEW SPECIMEN"键,即出现新样品测量窗口,弹出窗口。输入样品信息,如样品名称、方向。点击"OK"确认。

——调取 file-S-12

(c) 样品测量

测量样品磁化率各向异性的主窗口弹出。——调取 file-S-13

将样品固定在的测量位置 **1**(POS.1)上。 ——调取 file-I-7

测量样品绕 **X1** 轴转动,开始测量的 **AMS**。——调取 file-I-8

按"AXIS 1"键。——调取 file-S-14

测量完成后,测量结果将自动显示在 "Measurements"区域内的 Axis 1 上。

——调取 file-S-15

将样品固定在测量位置 **2** (POS.**2**)。——调取 file-l-**9** 

测量样品绕 X2 轴转动,开始测量的AMS。

——调取 file-I-10

按"AXIS 2"键。

——调取 file-S-16

将样品固定在测量位置 **3** (POS.3)。 ——调取 file-I-11

测量样品绕 X3 轴转动,开始测量的 AMS。——调取 file-I-12

测量完成后,测量结果将自动显示 在"Measurements"区域内的 Axis 2 上。

——调取 file-S-17

按 AXIS 3"键。

——调取 file-S-18

测量完成后,测量结果将自动显示在 "Measurements"区域内的 Axis 3 上。

# ——调取 file-S-19

保持样品在测量位置 3(POS.3)上不动,按"Bulk"键,测量样品在位置 3 上的磁化率值。测量结果显示在"Measurements""区域内。最终计算出 AMS 测量界面所有的数值。

——调取 file-S-20

(d) 保存数据

点击 "SAVE"保存数据。

——调取 file-S-21

(e) 测量多个样品 更换样品

按(b)-(e)步测量多个样品。

### B. 磁化率测量

在 "Instrument setting"下的 "Measurement mode"选择"Bulk susceptibility",根据测量的磁化率选择"Operating frequency",默认F1,测量高频磁化率选择F3。在"Bulk/Mass susceptibility"选择 默认"Bulk susceptibility","Volume"填写样品体积。

——调取 file-S-22

a、Holder 测量

在"Execute"下拉菜单中选择"Holder correction"",窗口弹出。——调取 file-S-23

保持样品架干净,无误——调取 file-I-6

调取 file-S-24 之后同步调取 ——synchroS-24 点击"START"开始测量,测量完成后,窗口最下部显示"HOLDER CORRECTION ROUTINE WAS SUCCESSFUL"保持绿色即可。点击"SAVE"保存新的 Holder 数据。测量样品的磁化率及其各向异性时,仪器将自动扣除Holder值。——调取 file-S-24

b、样品测量

(a) 新建数据文件

建立一个新的文件夹。在"File"下拉菜单中选择"New file"。设置好目录和名称之后,点击"OK"确认。测量的数据

将被保存在此新建文件夹中。

打开已经存在的文件夹。在"File"下 拉菜单中选择"Open new file",输入数据 文件名,窗口弹出。新的测量数据将被 添加到该文件中。

——调取 file-S-25

(b) 样品测量

点击"NEW SPECIMEN"键,即出现 新样品信息窗口。输入样品名、体积或 质量。点击"OK"确认。

——调取 file-S-26

点击"START"键开始测量。测量结果会自动显示在主界面上。按"NEW SPECIMEN"键开始下一个样品测量。

——调取 file-S-27

(c) 保存数据

点击 "SAVE"保存数据。

——调取 file-S-28

放置样品 ——调取 file-I-7

(d) 更换样品 将原样品换下,新样品固定重复(b)

- (d)

8. 降下升降架

测量完成后,在"Execute"下拉菜单中选择"Auxiliary commands",在"Up/Down"命令区,点击"Down",降下升降架。

——调取 file-S-29

样品架下降

——调取 file-I-13

关闭软件

9. 关机

依次关闭 MFK1-FA 卡帕桥磁化率仪。 笔记本电脑的电源和插线板开关,并用 罩布盖好仪器。

——调取 file-I-14